

---

---

**Protokół z I części zebrania plenarnego  
Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk  
Pałac Kultury i Nauki, Warszawa, 29 stycznia 2016**

Zebranie odbyło się 29 stycznia 2016 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

W zebraniu wzięło udział 32 członków Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk. Nieobecnych było 4 członków Komitetu.

Dziekan Wydziału IV PAN, **prof. Antoni Rogalski**, przywitał zebranych i poinformował o porządku zebrania.

Do celów przeprowadzanych głosowań zebrani jednogłośnie powołali Komisję Skrutacyjną w składzie: prof. Andrzej Michalski, dr hab. Marek Krętowski, dr hab. Ryszard Szczygieł.

**Dziekan** Wydziału IV wręczył zebranim pisemne powołania na członków Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN, gratulując zebranim wyboru oraz faktu wyboru wielu młodych pracowników nauki w skład Komitetu, a także wydawania przez Komitet wartościowego czasopisma znajdującego się na liście filadelfijskiej.

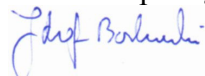
**Dziekan** Wydziału IV przedstawił najnowsze aktualne informacje dotyczące PAN oraz najważniejsze fakty dotyczące struktury, obecnych władz Akademii i zadań przed jakimi stoi Polska Akademia Nauk.

Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej PAN w głosowaniach tajnych dokonał następujących wyborów:

- **prof. Janusza Gajdę** na Przewodniczącego Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN na rozpoczynającą się kadencję Komitetu; **prof. Janusz Gajda** podziękował zebranim za wybór i zadeklarował dołożenie wszelkich starań w pracach dla dobra Komitetu oraz zaapelował o aktywny udział wszystkich członków Komitetu w jego pracach;
- **prof. Andrzeja Zajęca** i **dr hab. Józefa Borkowskiego** jako Wiceprzewodniczących Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN na rozpoczynającą się kadencję Komitetu;
- **dr hab. Ryszarda Srokę** na Sekretarza Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN i Członka Prezydium Komitetu na rozpoczynającą się kadencję Komitetu;
- **prof. Janusza Mroczkę** na funkcję Członka Prezydium Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN na rozpoczynającą się kadencję Komitetu;
- **prof. Stanisława Adamczaka** na funkcję Eksperta-Członka Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN na rozpoczynającą się kadencję Komitetu.

Dr hab. J. Borkowski przekazał wybranemu Sekretarzowi Komitetu obowiązki protokołowania dalszego przebiegu zebrania plenarnego Komitetu.

Protokół sporządził



Dr hab. inż. Józef Borkowski, prof. nadzw. PWr.  
Warszawa, 29 stycznia 2016 r.

Załączniki:

1. Lista obecności.
2. Protokół Komisji Skrutacyjnej.
3. Program zebrania plenarnego.

---

**Protokół z II części zebrania plenarnego  
Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk  
Pałac Kultury i Nauki, Warszawa, 29 stycznia 2016**

Po zakończeniu wyborów obowiązki protokołowania przejął nowy sekretarz Komitetu dr hab. inż. Ryszard Sroka.

**Prof. Antoni Rogalski** podziękował za sprawnie przeprowadzone wybory i przedstawił możliwości związane ze strukturą Komitetów PAN (komisje, sekcje) i zasady ich działania.

**Prof. Janusz Gajda** przedstawił propozycję, aby na razie nie powoływać stałych sekcji i komisji, a działać poprzez powoływane doraźnie Zespoły do konkretnych, pojawiających się zadań, np. ekspertyz. **Prof. Janusz Mroczka** i **prof. Antoni Rogalski** poparli zamierzenia nowego przewodniczącego Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN prof. Janusza Gajdy. Dziekan Wydziału IV PAN **prof. Antoni Rogalski** podziękował zebranych członkom Komitetu MiAN i opuścił zebranie.

**Prof. Janusz Gajda** przypomniał o zbliżającym się terminie nadsyłania prac na VII Kongres Metrologii organizowany przez Politechnikę Lubelską (pod patronatem Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej) i zachęcał do rozpowszechniania informacji o Kongresie oraz do zgłaszania prac przez członków Komitetu i ich współpracowników. Zaproponował aby członkowie Komitetu MiAN PAN wyrazili zgodę na pracę w Komitecie Naukowym Kongresu. Zaapelował o obecność wszystkich członków Komitetu MiAN na Kongresie i wyznaczył kolejny termin Zebrania Plenarnego w czasie trwania Kongresu Metrologii w Lublinie-Nałęczowie. Prosił także o przygotowanie spraw do dyskusji na tym spotkaniu i przedstawienie propozycji dodatkowych ekspertów mogących wejść w skład Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN. Następnie poprosił panów profesorów Piotra Kisałę i Waldemara Wójcika o przekazanie informacji nt. organizacji Kongresu. **Prof. Piotr Kisała** przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Kongresu Metrologii przedstawił terminy, sekcje tematyczne i miejsce organizacji Kongresu.

**Prof. Andrzej Michalski** zasygnalizował, że informacja o Kongresie nie dotarła do wielu osób zainteresowanych (potwierdziły to również głosy z sali), a **prof. Janusz Mroczka** zwrócił się z prośbą do organizatorów o jak najszybsze rozpowszechnienie informacji związanych z Kongresem, szczególnie w środowisku Metrologów.

**Prof. Waldemar Wójcik** zasygnalizował, że do Komitetu Naukowego kongresu zostały wstępnie zaproszone osoby spoza Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN.

**Prof. Janusz Mroczka** przypomniał, że Kongres jest organizowany pod patronatem KMian PAN i organizatorzy powinni uzgodnić skład Komitetu Naukowego Kongresu z Komitetem MiAN oraz nowym przewodniczącym, a Komitet MiAN musi zatwierdzić skład Komitetu Naukowego Kongresu Metrologii. Przypomniał również o konieczności przyjęcia nowego regulaminu Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN.

**Prof. Janusz Gajda** stwierdził, że aktualny skład KMian jest bardzo mocno zmieniony w stosunku do składu poprzedniego. Regulamin w poprzedniej kadencji był kompromisem w związku ze ścieraniem się poglądów kilku grup w starym składzie Komitetu. Dlatego regulamin prac Komitetu powinien być zatwierdzony ponownie po dyskusji na kolejnym

zebraniu plenarnym. Poprosił również organizatorów Kongresu Metrologii o przesłanie do akceptacji składu Komitetu Naukowego Kongresu.

**Prof. Janusz Mroczka** zapytał organizatorów o kwestię finansowania Kongresu i czy wystąpili do PAN o dofinansowanie i zachęcił do takiego wystąpienia do Dziekana Wydziału IV. Zgłosił również apel o jak najszybsze przygotowanie informatora o składzie Komitetu (prośba skierowana do prof. Wiesława Miczulskiego).

**Prof. Janusz Gajda** poprosił prof. Janusza Smulko o przedstawienie informacji związanych z funkcjonowaniem czasopisma Metrology & Measurement Systems, nad którym Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej sprawuje opiekę. **Prof. Janusz Smulko** rozdał przygotowane materiały dotyczące czasopisma i jego aktualnej pozycji, liczby przyznanych punktów, współczynnika IF i cytowalności (i najlepiej cytowanych prac) i omówił aktualny stan i pozycję czasopisma. **Prof. Janusz Gajda** zaapelował o dbałość o to czasopismo i motywowanie współpracowników do przesyłania prac na wysokim poziomie.

**Prof. Janusz Mroczka** przypomniał, że minęły już terminy pracy gremiów (np. Editorial Board, Komitet Naukowy) związanych z M&MS i że Komitet MiAN zobowiązany jest do zatwierdzenia nowych składów tych gremiów przed wydaniem kolejnego numeru czasopisma. Zaapelował o wskazanie Kandydatów do tych gremiów i upoważnienie Prezydium Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej do zatwierdzenia nowych składów Zespołów Redakcyjnych. Przeprowadzono jawne głosowanie w tej sprawie. Jednomyślnie podjęto decyzję o upoważnieniu Prezydium Komitetu do podjęcia decyzji w tej sprawie.

**Prof. Janusz Gajda** zaproponował przejście do punktu - "Wolne wnioski", w związku z brakiem jakichkolwiek pytań, informacji i wniosków, podziękował obecnym członkom Komitetu za uczestnictwo w pierwszym w kadencji 2016-2020 zebraniu plenarnym i zaprosił na kolejne spotkanie w Nałęczowie. Poprosił również o uaktualnienie danych do kontaktów, a następnie zamknął Zebranie.

Protokół sporządził



Dr hab. inż. Ryszard Sroka prof. n. AGH  
Warszawa, 29 stycznia 2016 r.